

<<SOC测试>>

图书基本信息

书名：<<SOC测试>>

13位ISBN编号：9787560539751

10位ISBN编号：7560539750

出版时间：2012-1

出版时间：西安交通大学出版社

作者：雷绍充

页数：257

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<SOC测试>>

### 内容概要

本书系统化介绍SOC测试方法与结构，主要内容包括SOC测试的原理和标准，扫描测试与内建自测试，软件自测试，测试压缩，低功耗测试，延迟测试，模拟与混合电路测试，RF电路测试，SOC与NOC测试。

本书既可作为高等院校电子与信息、计算机科学与技术 and 电气工程类高年级学生和研究生专业课教材，也可作为从事集成电路设计、制造、测试、应用、EDA和ATE专业人员的参考用书。

## &lt;&lt;SOC测试&gt;&gt;

## 书籍目录

## 第1章 简介

## 1.1 SOC测试的重要性

## 1.2 SOC测试一些标准

## 1.2.1 边界扫描(IEEE1149.1)

## 1.2.2 IEEE 1149.6

## 1.2.3 模拟与混合信号电路边界扫描标准IEEE 1149.4

## 1.2.4 IEEE 11500

## 1.2.5 IEEE 11687

## 参考文献

## 第2章 扫描测试与内建自测试

## 2.1 基本的扫描设计结构

## 2.1.1 基于多路选择器—D触发器的扫描设计

## 2.1.2 带时钟的扫描设计

## 2.1.3 电子敏感扫描设计

## 2.1.4 增强的扫描设计

## 2.2 低功耗扫描设计结构

## 2.2.1 多相或多序低功耗扫描设计

## 2.2.2 通带宽度匹配的低功耗扫描设计

## 2.3 实速扫描设计

## 2.4 逻辑内建自测试

## 2.4.1 测试图形生成电路

## 2.4.2 测试响应压缩

## 2.4.3 逻辑内建自测试结构

## 2.4.4 低功耗BIST结构

## 2.5 实速逻辑BIST了

## 2.5.1 单捕获

.....

## 第3章 SOC测试与NOC测试

## 第4章 测试压缩

## 第5章 延迟测试

## 第6章 低功耗测试

## 第7章 模拟与混合信号测试

## 第8章 射频电路测试

## 第9章 基本软件的自测试

## 附录

<<SOC测试>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>